**Виглин, Николай Альфредович.**

## Влияние носителей заряда на релаксацию магнитных ионов в магнитных полупроводниках : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.11. - Свердловск, 1984. - 110 с. : ил.

## Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Виглин, Николай Альфредович

ВВЕДЕНИЕ.

I. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ

ПОЛУПРОВОДНИКОВ ЕиО И Н^Сг^Ьег, (ОБЗОР)-.II

1.1. Основные физические свойства ЕиО.II

1.2. Основные физические свойства Я^Ох З.е^

1.3. Процессы спиновой релаксации в магнитно концентрированных соединениях.

1.4. д. -Фактор в ЕиО и И^Сг^Ъе^.

1.4.1. -фактор в ЕиО.

1.4.2. £ -фактор ъН^Сг^Ье.^.

1.5. Ширина линии магнитного резонанса при ферромагнитном упорядочении.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.'.

2.1. Измерение электропроводности образцов.

2.2. Методика измерений ЭПР.

2.3. Методика измерений ФМР.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПР В МОНООКСИДЕ ЕВРОПИЯ.

3.1. Зависимость электропроводности ЕиО от степени -легирования и отклонения состава от стехиометрического.

3.2. Температурная зависимость параметров

ЭПР в ЕиО.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПР В СЖЕНОХРОМИТЕ РТУТИ.

4.1. Электропроводность ¿с^ в зависимости от степени легирования и дефектности кристаллических подрешеток.

4.2. Исследование температурной зависимости ширины линии ЭПР

5. ИССЛЕДОВАНИЯ ФМР В СЕЛЕНОХРОМИТЕ РТУТИ.

5.1. Исследования ширины линии ФМР в

5.2. Исследования угловой зависимости резонансного поля ФМР в А^П^е^

ЗАШИЕНИЕ.